

2025년 4월 24일 (24.04.2025)



WIPO | PCT



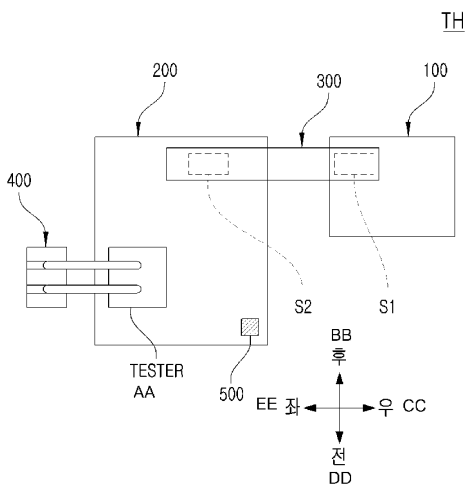
(10) 국제공개번호

WO 2025/084813 A1

- | | |
|--|---|
| (51) 국제특허분류:
G01R 31/28 (2006.01) H10N 10/80 (2023.01)
H01L 21/677 (2006.01) | (72) 발명자: 나윤성 (NA, Yun Sung); 31068 충청남도 천안시 동남구 향교1길 114-7 (KR). 김민석 (KIM, Min Seok); 31175 충청남도 천안시 서북구 충무로 158-10, 103동 2202호 (KR). 김지훈 (KIM, Jihoon); 18495 경기도 화성시 동탄신리천로2길 65, 2314동 702호 (KR). |
| (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/015775 | |
| (22) 국제출원일: 2024 년 10 월 17 일 (17.10.2024) | (74) 대리인: 특허법인 빛과소금 (LIGHT AND SALT PATENT AND LAW FIRM); 08506 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 1-312호 (KR). |
| (25) 출원언어: 한국어 | |
| (26) 공개언어: 한국어 | |
| (30) 우선권정보:
10-2023-0140575 2023 년 10 월 19 일 (19.10.2023) KR
10-2023-0140845 2023 년 10 월 20 일 (20.10.2023) KR
10-2023-0163835 2023 년 11 월 22 일 (22.11.2023) KR
10-2023-0163836 2023 년 11 월 22 일 (22.11.2023) KR
10-2024-0069634 2024 년 5 월 28 일 (28.05.2024) KR
10-2024-0083084 2024 년 6 월 25 일 (25.06.2024) KR
10-2024-0092706 2024 년 7 월 12 일 (12.07.2024) KR | (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MO, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW. |
| (71) 출원인: 주식회사 테크윙 (TECHWING, INC.) [KR/KR]; 18487 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 (KR). | |

(54) Title: HANDLER FOR TESTING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 발명의 명칭: 전자부품 테스트용 핸들러



AA ... TESTER
BB ... Rear
CC ... Right
DD ... Front
EE ... Left

(57) Abstract: The present invention relates to a handler for testing an electronic component. According to the present invention, the handler for testing an electronic component comprises: a supply and recovery device which supplies an electronic component that requires testing or retrieves an electronic component that has completed testing; a connection device which electrically connects the electronic component requiring a test and supplied from the supply and recovery device to a tester so that the electronic component can be tested, and sends the tested electronic component to the supply and recovery device; and a relay device for relaying the electronic component between the supply and recovery device and the connection device, wherein the connection device has a re-seating mechanism for re-seating a semiconductor element, loaded in a temporary position on a test chuck, into a correct position. According to the present invention, it is possible to provide a new type of handler capable of improving the reliability of a test by precisely arranging an electronic component and electrically connecting the electronic component and a tester more precisely.

(57) 요약서: 본 발명은 전자부품 테스트용 핸들러에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전자부품 테스트용 핸들러는 테스트가 필요한 전자부품을 공급하거나 테스트가 완료된 전자부품을 회수하는 공급 및 회수장치; 상기 공급 및 회수장치로부터 공급되어 온 테스트가 필요한 전자부품을 테스트에 전기적으로 연결하여 전자부품이 테스트될 수 있게 하고, 테스트가 완료된 전자부품을 상기 공급 및 회수부분으로 보내는 연결장치; 및 상기 공급 및 회수장치와 상기 연결장치 사이에서 전자부품을 중개하는 중개장치;를 포함하고, 상기 연결장치는 테스트척의 임시위치에 적재된 반도체소자를 정위치로 재안착시키는 재안착기구를 가진다. 본 발명에 따르면, 전자부품의 정밀한 정렬이 가능하여 전자부품과 테스트가 더 정교하게 전기적으로 연결될 수 있어서 테스트의 신뢰성이 향상될 수 있는 새로운 형태의 핸들러가 제공될 수 있다.

[다음 쪽 계속]

WO 2025/084813 A1

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))